

# 機器紹介

## 走査型電子顕微鏡



メーカー	日本電子株式会社
型式	JSM-6010LA
仕様	加速電圧 0.5 ~ 20 kV (43段) 分解能 (高真空) 4nm(20kV)、8nm(3kV)、15nm(1kV) 分解能 (低真空) 5nm(20kV) 画像モード 二次電子像、組成像、凹凸像、立体像 最大試料寸法 150mm φ 分析機能 全画面分析、点分析、元素マッピング 測長機能 2点間測長、円測長、角度測定、面積測定等

各種材料および製品の表面観察や微小部分分析をおこなう装置です。従って、表面の状態を確認したり、表面に付着した異物を分析する等により研究開発や品質管理に役立ちます。高真空モードと低真空モードを兼ね備えており、低真空モード（蒸着なし）では数千倍までの観察が可能であり、高真空モード（蒸着あり）では数万倍までの観察が可能です。

(信楽窯業技術試験場 セラミック材料担当 坂山)



平成24年度競輪補助物件  
財団法人 JKA

KEIRIN マークがついている機器は、競輪の補助金を受けて整備した機器です。